

内容

- 1. EMI 測試的基本概念與 EMI 的重要性
- 2. EMI 測試的常見測試問題
- 3. EMI 法規標準

什麼是 EMI

- EMI: 電磁干擾
 - 。 裝置操作受到外部電子來源的影響
 - 裝置功能可能會中斷、劣化或停止
 - 可能會發生資料劣化,甚至會發生資料全部遺失
- EMC: 電磁相容能力
 - 。 裝置在發生一定量的 EMI 時能正確運行
 - 。 滿足法律規範和系統規範,以避免裝置間干擾
- EMS: 電磁靈敏度
 - 。確定 EMI 對待測裝置的影響



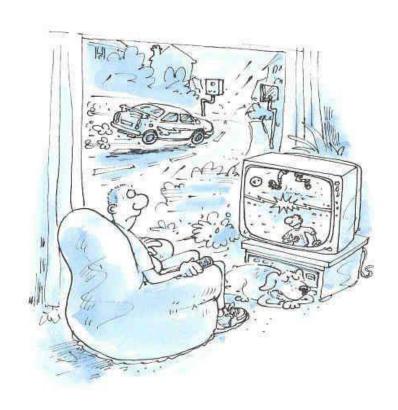
EMI:電磁干擾

- EMI 類型
 - · 來自發射器的窄頻 EMI
 - 。來自非故意干擾源的寬頻 EMI,如開關負載
- 放射 EMI
 - 。 電場或磁場放射
- 傳導 EMI
 - 。導體之間實體接觸



EMI 重要性實例

倒車雷達



汽車雷達偵測器發出訊號,對 英國衛星數位電視造成干擾

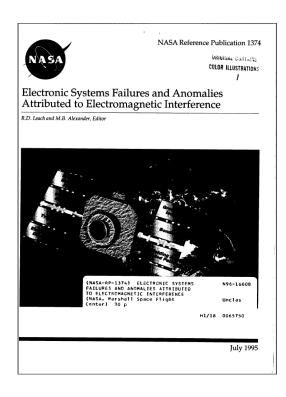
http://www.emcuk.co.uk/awareness/Pages/InterferenceExamples/Automotive.htm





EMI 重要性實例

DC-10 自動導航失效



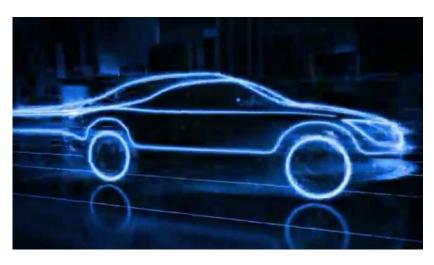
- 1993年,DC-10自動導航系統在最終即將 著陸時受到頭等艙乘客所操作的電池供電 CD播放機影響而損壞。
- 為防止飛行器突然偏離軌道後墜毀,飛行 員必須手動控制飛行器。

http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19960009442.pdf



EMI 重要性實例

汽車防鎖死煞車系統 (ABS) 失效



- 採用ABS的賓士汽車在沿著德國一段高速公路行駛時發生多次嚴重的煞車問題。
- 當駕駛人在高速公路曲線段煞車時,煞車受到附近無線電發射器的影響。
- 短期解決方案是沿著公路建立 一個網篩,衰減EMI,在司機 煞車時,煞車可恢復正常。

http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19960009442.pdf



EMI 測試的常見測試問題

EMI 整治和除錯是工程師在設計中不可迴避的問題:

- •一次性訊號難以通過昂貴的 EMI 相容性測試
- •難以擷取偶發的 EMI 突發訊號
 - 。 需要擁有較長儀器擷取時間的即時頻譜分析儀才可能擷取 EMI 突發訊號
 - 。 大多數的頻譜分析儀並非即時頻譜分析儀
- •EMI 除錯中很難找到雜訊來源
 - 。 截短 PCB 線路,然後重新連接,才有可能找到雜訊來源
 - 。 難以找到導致 EMI 的類比訊號和/或數位訊號



EMI 法規標準

• 大多數國家有法律要求,必須滿足電磁相容能力

• 裝置在特定頻率發出的 EMI 不得高於某個位準

• 裝置在受到特定量的 EMI 時可正常運作



TEL:03-5970828 FAX:03-5972622 新竹湖口工業區工業四路3號2F

EMI 標準

METRIC

MIL-STD-461F 10 December 2007

SUPERSEDING MIL-STD-461E 20 August 1999

DEPARTMENT OF DEFENSE INTERFACE STANDARD

REQUIREMENTS FOR THE CONTROL OF ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE CHARACTERISTICS OF SUBSYSTEMS AND EQUIPMENT



AMSC 9034

AREA EMCS

DISTRIBUTION STATEMENT A. Approved for public release, distribution is unlimited.

Source: https://assist.dla.mil — Downloaded: 2015-05-15701:092 Check the source to verify that this is the current version before use.

國家	標準
美國	FCC Part 15
美國軍事機構	MIL-STD-461F
加拿大	ICES 003
澳洲	AS 3548
日本	VCCI-V系列
紐西蘭	商務部 - CISPR 22
	EN 55022 IEC / CISPR 22 CISPR 11 CISPR 13 CISPR 20 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4 EN 60601-1-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61326-1
上台灣 発責聲明	CNS 13438
資料僮供參考,若有與原廠不合之處,請以原廠規格為準,且不供任何證明文件之用	

抽准



Tektronix

EMI 測試面臨的挑戰

2016年6月19日

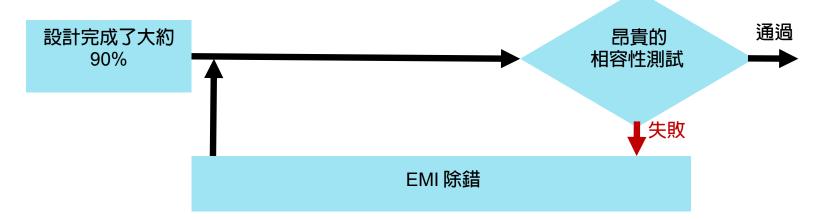


TEL:03-5970828 FAX:03-5972622 新竹湖口工業區工業四路3號2F

EMI 測試面臨的挑戰

EMI 測試工作流程

在測試實驗室安排測試





12

EMI 挑戰

- EMI 除錯是一項痛苦的工作,工程師必須找到雜訊來源的根本原因,以解決雜訊
 - 。 透過改變中繼裝置,進行製程除錯
 - 。 截短 PCB 線路,然後重新連接,直到找到雜訊來源
 - 。 難以找到導致 EMI 的類比訊號和/或數位訊號
- 難以擷取偶發的 EMI 突發
 - 。 需要擁有長儀器擷取時間的即時頻譜分析儀
 - 。 大多數的頻譜分析儀並非即時系統
 - 。大多數的即時頻譜分析儀成本高,攜帶不方便
- 在裝置發射射頻功率時,射頻可能會對電路造成負面影響,這可能會大幅度改變 EMI



13

Te//ronix®

- http://www.tek.com.tw
- 02-2656-6688